Obraz zawierający tekst, butelka, znak

Opis wygenerowany automatycznie

**Załącznik nr 1 do SWZ  
Nr postępowania: 84/2023/TP-I/DZP**

**FORMULARZ CENOWY /   
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW**

**Dotyczy postępowania** **prowadzonego w trybie podstawowym pt. „****Dostawa systemu typu EDEM do monitorowania materiałów ziarnistych z możliwością tworzenia analiz łączonych”.**

**System typu EDEM do monitorowania materiałów ziarnistych z możliwością tworzenia analiz łączonych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment /**  **Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.** | **Parametry oferowane\*** | **Producent oraz model\*** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(FxG)** |
| 1 | - System musi umożliwiać modelowanie materiałów ziarnistych do 10 milionów cząsteczek  - Wbudowana baza materiałów sypkich, wyposażona w kreator umożliwiający definicję dowolnego materiału sypkiego,  - Możliwość wykonywania obliczeń na wielu GPU  - Możliwość tworzenia analiz łączonych (one way/two way) z oprogramowniem oraz solverami zewnętrznymi takimi jak: Abaqus, AnsysMechanical, OptiStruct, HyperWorks, SimLab, AcusSolve, Fluent, OpenFOAM, Adams, MotionSolve, RecurDyn  - Możliwość wykonywania obliczeń w domenie dynamicznej, w tym z wykorzystaniem GPU.  -Licencja pływającą/sieciowa/hostowana oparta o jednostki.  -Możliwości wykonywania analiz łączonych (DEM+CFD, DEM+FEA,DEM+MBD) w ramach jednej licencji.  **Wymagania dodatkowe:**  Okres gwarancji 12 mies.  Wykorzystanie systemu w celu badań naukowych  Okres obowiązywania licencji min. 1 rok |  |  |  | **1szt.** |  |  |

**Data i podpis Wykonawcy: ………………………………**